



INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic field

Évaluation d'un équipement d'éclairage relativement à l'exposition humaine aux champs électromagnétiques

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 29.020, 29.140

ISBN 978-2-8322-2348-2

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD.....	6
INTRODUCTION.....	8
1 Scope.....	9
2 Normative references	9
3 Terms, definitions, physical quantities, units and abbreviations	10
3.1 Terms and definitions.....	10
3.2 Physical quantities and units.....	12
3.3 Abbreviations	13
4 Limits	13
4.1 General.....	13
4.2 Unintentional radiating part of lighting equipment.....	14
4.2.1 General	14
4.2.2 Lighting equipment deemed to comply with the Van der Hoofden test without testing	14
4.2.3 Application of limits.....	14
4.3 Intentional radiating part of lighting equipment.....	14
5 General requirements Van der Hoofden test	15
5.1 Measurand.....	15
5.2 Supply voltage and frequency	15
5.3 Measurement frequency range.....	16
5.4 Ambient temperature.....	16
5.5 Measurement equipment requirements.....	16
5.6 Measurement instrumentation uncertainty	17
5.7 Test report	17
5.8 Evaluation of results	18
6 Measurement procedure for the Van der Hoofden test	18
6.1 General.....	18
6.2 Operating conditions	18
6.2.1 Operating conditions for lighting equipment	18
6.2.2 Operating conditions for specific lighting equipment	18
6.2.3 Operating conditions for lighting equipment with intentional radiators	19
6.3 Measurement distance	19
6.4 Measurement set-up	19
6.4.1 General	19
6.4.2 Measurement set-up for specific lighting equipment.....	20
6.5 Location of measurement test head	20
6.6 Calculation of the results	20
7 Assessment procedure intentional radiators.....	20
7.1 General.....	20
7.2 Low-power exclusion method	20
7.2.1 General	20
7.2.2 Determination of the total radiated power	21
7.2.3 Determination of the low-power exclusion level.....	21
7.2.4 Summation of multiple transmitters	21
7.3 Application of the EMF product standard for body worn-equipment	21
7.4 Application of the EMF product standard for base stations	21

7.5	Application of another EMF standard	21
Annex A (normative)	Measurement distances	23
Annex B (informative)	Location of measurement test head	24
Annex C (informative)	Exposure limits	29
C.1	General.....	29
C.2	ICNIRP	29
C.2.1	ICNIRP 1998	29
C.2.2	ICNIRP 2010	29
C.3	IEEE	29
Annex D (informative)	Rationale measurement and assessment method.....	31
D.1	General.....	31
D.2	Induced internal electric field	31
D.2.1	General	31
D.2.2	Induced electric field due to the magnetic field; $E_{\text{eddy}}(f_i, d_{\text{loop}})$	33
D.2.3	Induced electric field due to the electric field; $E_{\text{cap}}(f_i, d)$	38
D.3	Thermal effects from 100 kHz to 300 GHz.....	41
D.3.1	General	41
D.3.2	The 100 kHz to 30 MHz contribution to the thermal effects	42
D.3.3	The 30 MHz to 300 MHz contribution to the thermal effects	43
D.3.4	Overall conclusion for the contribution to thermal effects	44
Annex E (normative)	Practical internal electric-field measurement and assessment method	45
E.1	Measurement of induced internal electric field.....	45
E.2	Calculation program.....	45
E.3	Compliance criterion for the Van der Hoofden head test.....	46
Annex F (normative)	Protection network	47
F.1	Calibration of the protection network.....	47
F.2	Calculation of the theoretical characteristic of the protection network.....	48
Annex G (informative)	Measurement instrumentation uncertainty	50
Annex H (informative)	Equipment deemed to comply	52
Annex I (informative)	Intentional radiators.....	54
I.1	General.....	54
I.2	Intentional radiators in lighting equipment.....	54
I.3	Properties of antennas in lighting applications	54
I.4	Exposure assessment approach.....	60
I.4.1	General	60
I.4.2	Determination of average total radiated power $P_{\text{int,rad}}$	60
I.4.3	Determination of the low-power exclusion level P_{max}	61
I.5	Multiple transmitters in a luminaire.....	61
I.6	Exposure to multiple luminaires	62
I.7	References in Annex I.....	62
Bibliography.....		64
Figure 1 – Compliance routes and pass/fail criteria for lighting equipment		15
Figure 2 – The Van der Hoofden test head.....		16
Figure 3 – Example of a protection circuit		17

Figure 4 – Measurement set-up	19
Figure 5 – Compliance demonstration procedure for the intentional-transmitter part of the lighting equipment.....	22
Figure B.1 – Location of measurement point in the transverse direction of lighting equipment – side view	24
Figure B.2 – Location of measurement points in the longitude direction of lighting equipment – side view	24
Figure B.3 – Location of measurement points in the longitude direction of lighting equipment; in the direction of illumination	25
Figure B.4 – Location of measurement point for lighting equipment with rotationally symmetrical dimensions.....	25
Figure B.5 – Location of measurement point for lighting equipment with rotationally symmetrical dimensions; in the direction of illumination	26
Figure B.6 – Location of measurement point for lighting equipment with the same dimensions in the x - and y - axis	26
Figure B.7 – Location of measurement point(s) for lighting equipment with single capped lamp (360° illumination).....	27
Figure B.8 – Location of measurement points for lighting equipment with a remote controlgear	27
Figure B.9 – Location of measurement point for an independent electronic converter	28
Figure B.10 – Location of measurement point(s) for an uplighter (floor standing/suspended).....	28
Figure D.1 – Overview measurement and assessment method.....	31
Figure D.2 – Distances of the head, loop and measurement set-up.....	33
Figure D.3 – Maximum current in the 2 m LLA as function of the frequency	35
Figure D.4 – Induced internal electric field and associated limit levels	37
Figure D.5 – Example of magnetic-field test result using the LLA.....	38
Figure D.6 – Distances of the head and measurement set-up	39
Figure D.7 – Plot of Equation (D.20)	39
Figure D.8 – Example of the CM-current measured using a conducted emission test	43
Figure F.1 – Test set-up for normalization of the network analyser.....	47
Figure F.2 – Test set-up for measurement of the voltage division factor using a network analyser.....	48
Figure F.3 – Calculated theoretical characteristic for the calibration of the protection network.....	49
Figure H.1 – Flow chart to determine applicability deemed to comply without F factor measurement.....	53
Figure I.1 – Luminaire with a transmitting antenna in a room.....	56
Figure I.2 – Impact of a conducting ceiling/plane	57
Figure I.3 – Electric field of a small electrical dipole: analytical formula vs far-field approximation	58
Figure I.4 – Electric field as a function of distance, antenna gain and input power (far-field approximation)	59
Figure I.5 – Impact of pulsed signals on the average exposure	60
Table 1 – Physical quantities and units	13
Table 2 – Receiver or spectrum analyser settings	16
Table A.1 – Lighting equipment and measurement distances	23

Table C.1 – Basic restrictions for general public exposure to time varying electric and magnetic fields for frequencies between 100 kHz and 10 GHz	29
Table C.2 – Basic restrictions for general public exposure to time varying electric and magnetic fields for frequencies up to 10 MHz	29
Table C.3 – IEEE basic restrictions (BR) for the general public	30
Table C.4 – IEEE basic restrictions (BR) between 100 kHz and 3 GHz for the general public	30
Table D.1 – Induced internal electric field calculations	34
Table D.2 – Calculation main contributions	40
Table D.3 – Frequency steps for the amplitude addition that equals 1,11 times B_6	41
Table D.4 – Frequency steps for the power addition that equals 0,833 times B_6	42
Table D.5 – Field strength limits according to CISPR 15	43
Table E.1 – Conductivity as a function of frequency (see Table C.1 of IEC 62311:2007)	46
Table G.1 – Uncertainty calculation for the measurement method described in Clauses 5 and 6 in the frequency range from 20 kHz to 10 MHz	50
Table G.2 – Comments and information to Table G.1	51
Table I.1 – Overview of wireless radio technologies that might be applied in lighting systems	55

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ASSESSMENT OF LIGHTING EQUIPMENT RELATED TO HUMAN EXPOSURE TO ELECTROMAGNETIC FIELDS

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62493 has been prepared by IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2009. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) identification of lighting product types deemed to comply with the standard without the need for test;
- b) deletion of the need for CISPR-15-compliance as a prerequisite for IEC 62493 compliance;
- c) inclusion of the consequences of the ICNIRP 2010 guidelines for (up to 100 kHz);
- d) adding some guidance to the Van der Hoofden test head method to improve reproducibility of results;
- e) inclusion of compliance demonstration method for products having intentional radiators.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
34/222/FDIS	34/228/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 62493 series, published under the general title *Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields*, can be found on the IEC website.

The exposure limits given in Annex C (informative) are for information only; they do not comprise an exhaustive list and are valid only in certain regions of the world. It is the responsibility of users of this standard to ensure that they use the current version of the limit values specified by the applicable national authorities.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

This International Standard establishes a suitable evaluation method for the influence of the electromagnetic fields in the space around the equipment mentioned in the scope, and defines standardized operating conditions and measurement distances.

This standard is designed to assess, by measurements and/or calculations, electromagnetic (EM) fields and their potential effect on the human body by reference to exposure levels of the general public given by ICNIRP:1998 [1]¹, ICNIRP 2010 [2], IEEE C95.1:2005 [3] and IEEE C95.6:2002 [4]. The exposure levels with which to comply are basic restrictions (both ICNIRP- and IEEE-based).

Based on the lighting equipment operating properties, the frequency range of the applicable basic restrictions can be limited as follows:

- internal electric field between 20 kHz and 10 MHz;
- specific absorption rate (SAR) between 100 kHz and 300 MHz;
- power density is outside the scope.

NOTE Operating frequencies of lighting equipment are higher than 20 kHz to avoid audible noise and infrared interference. Frequency contributions above 300 MHz can be neglected.

This standard is not meant to supplant definitions and procedures specified in exposure standards, but it is aimed at supplementing the procedure already specified for compliance with exposure.

¹ Numbers in square brackets refer to the Bibliography.

ASSESSMENT OF LIGHTING EQUIPMENT RELATED TO HUMAN EXPOSURE TO ELECTROMAGNETIC FIELDS

1 Scope

This International Standard applies to the assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields. The assessment consists of the induced internal electric field for frequencies from 20 kHz to 10 MHz and the specific absorption rate (SAR) for frequencies from 100 kHz to 300 MHz around lighting equipment.

Included in the scope of this standard are:

- all lighting equipment with a primary function of generating and/or distributing light intended for illumination purposes, and intended either for connection to the low voltage electricity supply or for battery operation; used indoor and/or outdoor;
- lighting part of multi-function equipment where one of the primary functions of this is illumination;
- independent auxiliaries exclusively for the use with lighting equipment;
- lighting equipment including intentional radiators for wireless communication or control.

Excluded from the scope of this standard are:

- lighting equipment for aircraft and airfields;
- lighting equipment for road vehicles; (except lighting used for the illumination of passenger compartments in public transport)
- lighting equipment for agriculture;
- lighting equipment for boats/vessels;
- photocopiers, slide projectors;
- apparatus for which the requirements of electromagnetic fields are explicitly formulated in other IEC standards.

NOTE The methods described in this standard are not suitable for comparing the fields from different lighting equipment.

This standard does not apply to built-in components for luminaires such as electronic controlgear.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 62209-2:2010, *Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices – Human models, instrumentation, and procedures – Part 2: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for wireless communication devices used in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz)*

IEC 62232:2011, *Determination of RF field strength and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure*

IEC 62311:2007, *Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz – 300 GHz)*

IEC 62479:2010, *Assessment of the compliance of low-power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)*

CISPR 16-1-1, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods. Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Measuring apparatus*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	70
INTRODUCTION	72
1 Domaine d'application	73
2 Références normatives	73
3 Termes, définitions, grandeurs physiques, unités et abréviations	74
3.1 Termes et définitions	74
3.2 Grandeurs physiques et unités	77
3.3 Abréviations	77
4 Limites	78
4.1 Généralités	78
4.2 Partie de l'équipement d'éclairage présentant un rayonnement non intentionnel	78
4.2.1 Généralités	78
4.2.2 Equipement d'éclairage considéré comme satisfaisant à l'essai de Van der Hoofden sans essai	78
4.2.3 Application des limites	79
4.3 Partie de l'équipement d'éclairage présentant un rayonnement intentionnel	79
5 Exigences générales de l'essai de Van der Hoofden	80
5.1 Mesurage	80
5.2 Tension et fréquence d'alimentation	81
5.3 Gamme des fréquences de mesure	81
5.4 Température ambiante	81
5.5 Exigences en matière d'équipement de mesure	81
5.6 Incertitude liée à l'instrumentation de mesure	83
5.7 Rapport d'essai	83
5.8 Evaluation des résultats	83
6 Procédure de mesure pour l'essai de Van der Hoofden	84
6.1 Généralités	84
6.2 Conditions de fonctionnement	84
6.2.1 Conditions de fonctionnement de l'équipement d'éclairage	84
6.2.2 Conditions de fonctionnement d'un équipement d'éclairage spécifique	84
6.2.3 Conditions de fonctionnement d'un équipement d'éclairage doté de éléments rayonnants intentionnels	84
6.3 Distance de mesure	84
6.4 Montage de mesure	85
6.4.1 Généralités	85
6.4.2 Montage de mesure d'un équipement d'éclairage spécifique	85
6.5 Emplacement de la tête d'essai de mesure	86
6.6 Calcul des résultats	86
7 Éléments rayonnants intentionnels de la procédure d'évaluation	86
7.1 Généralités	86
7.2 Méthode d'exclusion à faible puissance	86
7.2.1 Généralités	86
7.2.2 Détermination de la puissance totale rayonnée	87
7.2.3 Détermination du niveau d'exclusion à faible puissance	87
7.2.4 Addition d'émetteurs multiples	87

7.3	Application de la norme de produit sur les EMF pour les équipements portés près du corps	87
7.4	Application de la norme de produit sur les EMF pour les stations de base.....	87
7.5	Application d'une autre norme sur les EMF	88
Annexe A (normative) Distances de mesure.....		89
Annexe B (informative) Emplacement de la tête d'essai de mesure.....		90
Annexe C (informative) Limites d'exposition.....		95
C.1	Généralités	95
C.2	ICNIRP	95
C.2.1	ICNIRP 1998	95
C.2.2	ICNIRP 2010	95
C.3	IEEE	96
Annexe D (informative) Méthode justificative d'évaluation et de mesure.....		97
D.1	Généralités	97
D.2	Champ électrique interne induit.....	97
D.2.1	Généralités	97
D.2.2	Champ électrique induit dû au champ magnétique; $E_{\text{Foucault}}(f_i, d_{\text{boucle}})$	99
D.2.3	Champ électrique induit dû au champ électrique; $E_{\text{cap}}(f_i, d)$	104
D.3	Effets thermiques de 100 kHz à 300 GHz.....	108
D.3.1	Généralités	108
D.3.2	Contribution 100 kHz à 30 MHz aux effets thermiques	108
D.3.3	Contribution 30 MHz à 300 MHz aux effets thermiques	110
D.3.4	Conclusion globale concernant la contribution aux effets thermiques	111
Annexe E (normative) Méthode pratique d'évaluation et de mesure des champs électriques internes		112
E.1	Mesure du champ électrique interne induit	112
E.2	Programme de calcul	112
E.3	Critère de conformité pour l'essai de tête de Van der Hoofden	113
Annexe F (normative) Réseau de protection		115
F.1	Etalonnage du réseau de protection.....	115
F.2	Calcul de la caractéristique théorique du réseau de protection.....	116
Annexe G (informative) Incertitude liée à l'instrumentation de mesure		118
Annexe H (informative) Equipement considéré conforme		120
Annexe I (informative) Éléments rayonnants intentionnels		122
I.1	Généralités	122
I.2	Éléments rayonnants intentionnels dans les équipements d'éclairage	122
I.3	Propriétés des antennes dans les applications d'éclairage.....	122
I.4	Approche d'évaluation d'exposition	129
I.4.1	Généralités	129
I.4.2	Détermination de la puissance totale rayonnée moyenne $P_{\text{int,rad}}$	129
I.4.3	Détermination du niveau d'exclusion à faible puissance P_{max}	130
I.5	Emetteurs multiples d'un luminaire.....	131
I.6	Exposition à des luminaires multiples.....	131
I.7	Références à l'Annexe I	132
Bibliographie.....		133

Figure 1 – Marches à suivre pour l'établissement de la conformité et critères d'acceptation/échec pour l'équipement d'éclairage	80
Figure 2 – Tête d'essai Van der Hoofden	82
Figure 3 – Exemple de circuit de protection	82
Figure 4 – Montage de mesure	85
Figure 5 – Procédure de démonstration de conformité pour la partie de l'équipement d'éclairage comportant un émetteur intentionnel	88
Figure B.1 – Emplacement du point de mesure dans la direction transversale de l'équipement d'éclairage – vue de côté	90
Figure B.2 – Emplacement des points de mesure dans la direction longitudinale de l'équipement d'éclairage – vue de côté	90
Figure B.3 – Emplacement des points de mesure dans la direction longitudinale de l'équipement d'éclairage; dans la direction de l'éclairage	91
Figure B.4 – Emplacement du point de mesure d'un équipement d'éclairage dont les dimensions présentent une symétrie de rotation	91
Figure B.5 – Emplacement du point de mesure d'un équipement d'éclairage dont les dimensions présentent une symétrie de rotation; dans la direction de l'éclairage	92
Figure B.6 – Emplacement du point de mesure d'un équipement d'éclairage ayant des dimensions identiques sur l'axe x et l'axe y	92
Figure B.7 – Emplacement du ou des points de mesure d'un équipement d'éclairage avec lampe à un seul culot (éclairage à 360°)	93
Figure B.8 – Emplacement des points de mesure d'un équipement d'éclairage muni d'un appareillage à distance	93
Figure B.9 – Emplacement du point de mesure d'un convertisseur électronique indépendant	94
Figure B.10 – Emplacement du/des points de mesure d'un luminaire à éclairage dirigé vers le haut (au sol/suspendu)	94
Figure D.1 – Vue d'ensemble de la méthode d'évaluation et de mesure	97
Figure D.2 – Distances de la tête, de la boucle et du montage de mesure	99
Figure D.3 – Courant maximal dans la LLA de 2 m, en fonction de la fréquence	101
Figure D.4 – Champ électrique interne induit et niveaux limites associés	103
Figure D.5 – Exemple de résultat d'essai de champ magnétique utilisant la LLA	104
Figure D.6 – Distances entre la tête et le montage de mesure	105
Figure D.7 – Courbe de l'Equation (D.20)	106
Figure D.8 – Exemple du courant c_m mesuré au moyen d'un essai d'émission conduite	110
Figure F.1 – Montage d'essai pour l'étalonnage de l'analyseur de réseau	115
Figure F.2 – Montage d'essai pour la mesure du facteur de division en tension à l'aide d'un analyseur de réseau	116
Figure F.3 – Caractéristique théorique calculée pour l'étalonnage du réseau de protection	117
Figure H.1 – Organigramme pour déterminer l'applicabilité de la conformité sans mesure de facteur F	121
Figure I.1 – Luminaire avec antenne d'émission dans une pièce	125
Figure I.2 – Influence d'un plafond/plan conducteur	126
Figure I.3 – Champ électrique d'un petit doublet électrique: formule analytique en fonction de l'approximation de champ lointain	127
Figure I.4 – Champ électrique en fonction de la distance, du gain d'antenne et de la puissance d'entrée (approximation de champ lointain)	128

Figure I.5 – Influence des signaux d’impulsions sur l’exposition moyenne	130
Tableau 1 – Grandeurs physiques et unités	77
Tableau 2 – Réglages du récepteur ou de l’analyseur de spectre	81
Tableau A.1 – Equipement d’éclairage et distances de mesure	89
Tableau C.1 – Restrictions de base concernant l’exposition du grand public aux champs électriques et magnétiques variant dans le temps, pour des fréquences comprises entre 100 kHz et 10 GHz	95
Tableau C.2 – Restrictions de base concernant l’exposition du grand public aux champs électriques et magnétiques variant dans le temps pour des fréquences allant jusqu’à 10 MHz	95
Tableau C.3 – Restrictions de base (BR) de l’IEEE pour le grand public	96
Tableau C.4 – Restrictions de base (BR) de l’IEEE entre 100 kHz et 3 GHz pour le grand public	96
Tableau D.1 – Calculs de champ électrique interne induit	100
Tableau D.2 – Calcul des contributions du réseau	106
Tableau D.3 – Pas en fréquence pour l’addition d’amplitude égal à 1,11 fois B_6	107
Tableau D.4 – Pas en fréquence pour l’addition des puissances égal à 0,833 fois B_6	108
Tableau D.5 – Limites d’intensité du champ selon la CISPR 15	111
Tableau E.1 – Conductivité en fonction de la fréquence (voir Tableau C.1 de l’IEC 62311:2007)	113
Tableau G.1 – Calcul de l’incertitude pour la méthode de mesure décrite à l’Article 5 et à l’Article 6 dans la gamme de fréquences comprises entre 20 kHz et 10 MHz	118
Tableau G.2 – Commentaires et informations relatifs au Tableau G.1	119
Tableau I.1 – Présentation des technologies radio sans fil qui sont susceptibles d’être appliquées aux systèmes d’éclairage	124

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ÉVALUATION D'UN ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE RELATIVEMENT À L'EXPOSITION HUMAINE AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 62493 a été établie par le comité d'études 34 de l'IEC: Lampes et équipements associés.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition, parue en 2009. Cette édition constitue une révision technique.

La présente édition inclut les modifications techniques significatives suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) identification des types de produits d'éclairage considérés comme satisfaisant à la norme sans qu'il soit nécessaire de procéder à des essais;
- b) suppression de la condition préalable consistant à se conformer à la norme CISPR 15 pour satisfaire aux exigences de l'IEC 62493;
- c) inclusion des conséquences des lignes directrices de l'ICNIRP 2010 (jusqu'à 100 kHz);

- d) ajout de recommandations pour la "méthode de la tête d'essai de Van der Hoofden" afin d'améliorer la reproductibilité des résultats;
- e) inclusion de la méthode de démonstration de conformité des produits dotés d'éléments rayonnants intentionnels.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
34/222/FDIS	34/228/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62493, publiées sous le titre général *Evaluation d'un équipement d'éclairage relativement à l'exposition humaine aux champs électromagnétiques*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Les limites d'exposition indiquées à l'Annexe C (informative) sont données pour information seulement; elles ne constituent pas une liste exhaustive et ne sont valables que dans certaines régions du monde. Il est de la responsabilité des utilisateurs de la présente norme de s'assurer qu'ils utilisent la version en cours des valeurs limites spécifiées par les autorités nationales concernées.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

La présente Norme internationale établit une méthode d'évaluation appropriée concernant l'influence des champs électromagnétiques dans l'espace situé autour des équipements mentionnés dans le domaine d'application. Elle définit également les conditions de fonctionnement et les distances de mesure normalisées.

Cette norme est conçue pour évaluer, grâce à des mesures et/ou à des calculs, les champs électromagnétiques (EM) et leur effet potentiel sur le corps humain, en référence aux niveaux d'exposition du grand public qui sont donnés dans l'ICNIRP:1998 [1]¹, l'ICNIRP 2010 [2], l'IEEE C95.1:2005 [3] et l'IEEE C95.6:2002 [4]. Les niveaux d'exposition auxquels satisfaire correspondent aux restrictions de base (reposant à la fois sur l'ICNIRP et l'IEEE).

En fonction des propriétés de fonctionnement de l'équipement d'éclairage, la gamme de fréquences des restrictions de base applicables peut être limitée comme suit:

- champ électrique interne entre 20 kHz et 10 MHz;
- débit d'absorption spécifique (DAS) compris entre 100 kHz et 300 MHz;
- densité de puissance en dehors du domaine d'application.

NOTE Les fréquences de fonctionnement de l'équipement d'éclairage sont supérieures à 20 kHz, pour éviter les bruits audibles et les interférences infrarouges. Les contributions de fréquence au-delà de 300 MHz peuvent être négligées.

Cette norme n'a pas pour but de remplacer les définitions et procédures spécifiées dans les normes relatives à l'exposition, mais de compléter la procédure déjà spécifiée pour la conformité à l'exposition.

¹ Les chiffres entre crochets se réfèrent à la Bibliographie.

ÉVALUATION D'UN ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE RELATIVEMENT À L'EXPOSITION HUMAINE AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale traite de l'évaluation d'un équipement d'éclairage relativement à l'exposition humaine aux champs électromagnétiques. L'évaluation comprend le champ électrique interne induit pour les fréquences comprises entre 20 kHz et 10 MHz et le débit d'absorption spécifique (DAS) pour les fréquences comprises entre 100 kHz et 300 MHz autour de l'équipement d'éclairage.

Sont inclus dans le domaine d'application de la présente norme:

- tous les équipements d'éclairage ayant pour fonction principale de générer et/ou de répartir la lumière à des fins d'éclairage, et destinés à être raccordés soit à une alimentation électrique basse tension soit à une batterie, pour utilisation en intérieur et/ou en extérieur;
- la partie des appareils à fonctions multiples destinée à l'éclairage lorsqu'une des principales fonctions de ces appareils est l'éclairage lumineux;
- les organes auxiliaires indépendants, à utiliser exclusivement avec l'équipement d'éclairage;
- les équipements d'éclairage contenant intentionnellement des éléments rayonnants pour les communications ou les commandes sans fil.

Sont exclus du domaine d'application de la présente norme:

- les équipements d'éclairage des avions et des aéroports;
- les équipements d'éclairage des véhicules routiers (excepté l'éclairage des compartiments passagers dans les transports en commun)
- les équipements d'éclairage agricoles;
- les équipements d'éclairage des bateaux/navires;
- les photocopieurs, les projecteurs de documents;
- les appareils pour lesquels les exigences en matière de champs électromagnétiques sont formulées de manière explicite dans d'autres normes IEC.

NOTE Les méthodes décrites dans la présente norme ne sont pas adaptées pour comparer les champs de différents équipements d'éclairage.

La présente norme ne s'applique pas aux composants intégrés dans des luminaires, tels que des appareillages électroniques.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 62209-2:2010, *Exposition humaine aux champs radiofréquence produits par les dispositifs de communications sans fils tenus à la main ou portés près du corps – Modèles de corps humain, instrumentation et procédures – Partie 2: Procédure de détermination du débit*

d'absorption spécifique produit par les appareils de communications sans fil utilisés très près du corps humain (gamme de fréquences de 30 MHz à 6 GHz)

IEC 62232:2011, Détermination des champs radiofréquences et du DAS aux environs des stations de base utilisées pour les communications radio dans le but d'évaluer l'exposition humaine

IEC 62311:2007, Evaluation des équipements électroniques et électriques en relation avec les restrictions d'exposition humaine aux champs électromagnétiques (0 Hz – 300 GHz)

IEC 62479:2010, Evaluation de la conformité des appareils électriques et électroniques de faible puissance avec les restrictions de base concernant l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (10 MHz à 300 GHz)

CISPR 16-1-1, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques. Partie 1-1: Appareils de mesures des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Appareils de mesure